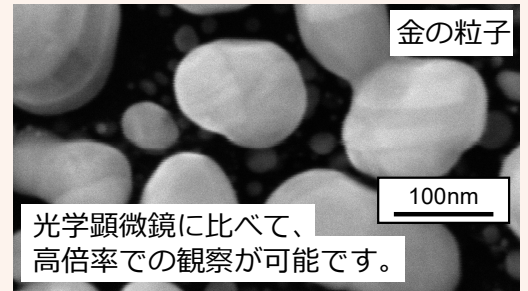


エネルギー分散型X線分析装置 (SEM) が新しくなりました

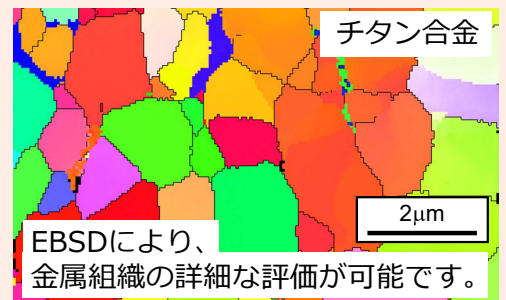
本体



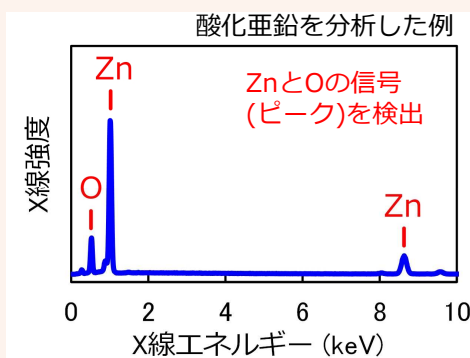
SEMによる観察



結晶方位の解析



EDSによる分析



試料の化学成分を分析することが可能です。

コーティング



試料に導電性を付与するための白金・
カーボンのコーティングが可能です。

本機器は、エネルギー分散型X線検出器 (EDS) を走査電子顕微鏡 (SEM) に搭載したもので、製品の開発、品質管理、不具合原因の調査に活用される装置です。試料に電子線を照射して、試料から放出された信号 (二次電子や特性X線等) を検出することで、試料表面を拡大観察しながら、目的とする箇所の化学成分を分析することができます。

お問い合わせは…

沼津工業技術支援センター機械電子科 TEL : 055-925-1103